

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.В.09
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Физические основы электроники

(наименование дисциплины)

11.03.04 Электроника и нанoeлектроника

по направлению подготовки (специальности)

Электроника и робототехника

направленность (профиль)/специализация

Форма обучения: очная

Год набора: 2026

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	7	Итого
Форма контроля	Экзамен	
Вид занятий		
Лекции	16	16
Лабораторные	16	16
Практические		
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР		
Промежуточная аттестация	0,35	0,35
Контактная работа	32,35	32,35
Самостоятельная работа	40	40
Контроль	35,65	35,65
Итого	108	108

Рабочую программу составил:

доцент, доцент, к.т.н. Прядилов А.В.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

☒

Отсутствует

☐

Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки (специальности)

11.03.04Электроника и нанoeлектроника

Срок действия рабочей программы дисциплины до «31» августа 2030 г.

УТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры

Промышленная электроника

(протокол заседания № 5 от «11» декабря 2025 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель – научить студентов принимать обоснованные решения о возможности использования полупроводниковых приборов в заданных условиях эксплуатации.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина:

- физика
- теоретические основы электротехники

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

- Основы микропроцессорной техники
- Схемотехника

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотносящиеся с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
ПК-2 Способен аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения	ИД-1ПК-2 Знает методики проведения исследований параметров и характеристик узлов, блоков; ИД-2ПК-2 Умеет проводить исследования характеристик электронных приборов.	Знать: методики проведения исследований параметров и характеристик узлов, блоков
		Уметь: проводить исследования характеристик электронных приборов
		Владеть:навыком аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Се- местр	Объем, ч.	Бал- лы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
Модуль №1	Лек, Лаб, Ср	Введение. Предмет и содержание дисциплины. Основные разделы дисциплины. Основы физики полупроводников.	7	18		-	Защита ЛР
		Кинетические явления в полупроводниках, статистика Ферми-Дирака, поверхностные и контактные явления в полупроводниках, контакт металл-диэлектрик-полупроводник (МДП).				-	
		Электрические переходы. Электронно-дырочный переход и его свойства. Вывод и анализ вольт-амперной характеристики идеализированного р-п-перехода.				-	
		Вывод и анализ вольт-амперной характеристики идеализированного р-п-перехода.				-	
Модуль №2	Лек, Лаб, Ср	Особенности ВАХ реальных полупроводниковых приборов. Пробои р-п-перехода. Переходные процессы при переключении реального диода.	7	18		-	Защита ЛР
		Выпрямительные, импульсные и высокочастотные диоды.				-	
		Методы расчета нагрузочной способности полупроводниковых приборов.				-	
		Светодиоды и полупроводниковые лазеры. Фотоприемники.				-	
Модуль №3	Лек, Лаб, Ср	Принцип работы и виды биполярных транзисторов. Режимы работы и схемы включения.	7	18		-	Защита ЛР
		Модели и работа биполярного транзистора в стационарном и динамических режимах				-	
		Виды и классификация полевых транзисторов.				-	
		Полевые транзисторы с изолированным затвором.				-	
Модуль №4	Лек, Лаб, Ср	Полевой транзистор с управляющим р-п-переходом.	7	18		-	Защита ЛР
		IGBT транзисторы				-	
		Тиристоры. Переходные процессы в тиристоре при включении и выключении				-	
	ПА		7	0,35			
	Контроль		7	35,65			
Итого:				108			

5. Образовательные технологии

1. Технологии традиционного обучения
 - 1.1. Лекционные занятия
 - 1.2. Практические задания
 - 1.3. Самостоятельная работа
 - 1.4. Лабораторные занятия
 - 1.5. Индивидуальные домашние задания (в качестве вопроса к защите лабораторной работы)
2. Технология модульного обучения
 - 2.1. Разбитие преподаваемого материала на отдельные модули
3. Технология проблемного обучения
 - 3.1. Эвристическая беседа
 - 3.2. Дискуссия
 - 3.3. Учебное исследование
4. Технология обучения в сотрудничестве
 - 4.1. Разбиение студентов на команды для решения конкретных задач
5. Интерактивные технологии
 - 5.1. Демонстрационный метод обучения
 - 5.2. Работа в группах
 - 5.3. Эвристическая беседа

6. Методические указания по освоению дисциплины

Рекомендуется посещение лекционных занятий; самостоятельное изучение материала; выполнение, оформление и защита лабораторных работ.

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
7	ПК-2	Выполнение и защита лабораторных работ. Вопросы к экзамену.

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

7.2.1. Выполнение и защита лабораторных работ

Типовой пример задания:

Выполнить, оформить и защитить лабораторную работу

Краткое описание и регламент выполнения

Лабораторные выполняются в бригадах. Лабораторная должна быть выполнена. Результаты оформлены в виде отчета. Далее студент должен защитить работу, ответив на теоретический или практический вопрос.

Критерии оценки:

Лабораторная не выполнена: студент получает отрицательные штрафные баллы.

Лабораторная оформлена: студент получает баллы за оформление.

Лабораторная защищена: студент получает баллы за защиту.

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр 7

№ п/п	Вопросы к экзамену
1	Этапы развития электроники
2	Отличия полупроводников от диэлектриков и проводников. Их энергетическая диаграмма для отдельного атома и для объема вещества.
3	Собственные и примесные полупроводники. Их особенности.
4	Явления генерации и рекомбинации носителей заряда в собственных полупроводниках.
5	Явления генерации и рекомбинации носителей заряда в примесных полупроводниках.
6	Статистика Ферми-Дирака в собственных полупроводниках.
7	Статистика Ферми-Дирака в примесных полупроводниках.
8	Влияние температуры на состояние полупроводников.
9	Полупроводник в электрическом поле.
10	Явления в системе металл-диэлектрик-полупроводник.
11	Электрические переходы и их виды.
12	Электронно-дырочный переход, его виды.
13	Технологии получения электронно-дырочных переходов.
14	Электронно-дырочный переход в равновесном состоянии. Энергетическая диаграмма, распределение концентраций примесей и носителей заряда, возникновение внутреннего электрического поля и запирающего слоя, емкостные свойства перехода, диффузионные и дрейфовые составляющие тока через переход (для несимметричного перехода).
15	Электронно-дырочный переход при прямом смещении. Энергетическая диаграмма, распределение концентраций примесей и носителей заряда, изменение внутреннего электрического поля и запирающего слоя, емкостных свойств перехода, явление инжекции носителей заряда (для несимметричного перехода).
16	Электронно-дырочный переход при обратном смещении. Энергетическая диаграмма, распределение концентраций примесей и носителей заряда, изменение внутреннего электрического поля и запирающего слоя, емкостных свойств перехода, явление экстракции носителей заряда (для несимметричного перехода).
17	Вольт-амперная характеристика электронно-дырочного перехода, ее зависимость от изменения температуры, материала исходного полупроводника и площади перехода.
18	Характеристические сопротивления диода и его нагрузочный режим работы.
19	ВАХ реального диода, ее линейная аппроксимация и схемы замещения диода при прямом смещении.
20	ВАХ реального диода, ее линейная аппроксимация и схемы замещения диода при обратном смещении.
21	Пробой электронно-дырочного перехода, его разновидности и особенности лавинного пробоя.
22	Пробой электронно-дырочного перехода, его разновидности и особенности теплового пробоя.
23	Тепловые параметры полупроводниковых приборов и методика расчета температуры перехода для единичного импульса мощности.
24	Расчет температуры прибора графоаналитическим методом.
25	Высокочастотные диоды
26	Импульсные диоды. Работа диодного ключа.
27	Туннельный пробой. Туннельный и обращенный диоды.

28	Стабилитроны и стабилитроны.
29	Биполярные транзисторы. Устройство и принцип действия транзистора, как усилительного прибора.
30	Параметры транзисторной структуры
31	Режимы работы биполярного транзистора и схемы его включения.
32	Семейства ВАХ транзистора в схеме с общим эмиттером и особенности схемы с ОЭ.
33	Семейства ВАХ транзистора в схеме с общей базой и особенности схемы с ОБ.
34	Т-образные эл. схемы замещения биполярного транзистора для постоянных составляющих сигнала.
35	Т-образные эл. схемы замещения биполярного транзистора для переменных составляющих сигнала.
36	П-образная гибридная эквивалентная электрическая схема замещения биполярного транзистора.
37	Малосигнальные параметры, их виды и особенности.
38	Системы h- и H-параметров
39	Системы Y- и y-параметров.
40	Системы Z- и z-параметров.
41	Импульсные биполярные транзисторы.
42	Методы улучшения частотных и импульсных свойств биполярных транзисторов. Дрейфовые транзисторы.
43	Полевые транзисторы с управляющим р-п-переходом, устройство, семейства ВАХ, схемы замещения .
44	Полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом, ВАХ, схемы замещения и.
45	Полевые транзисторы с изолированным затвором и встроенным каналом, ВАХ, схемы замещения .
46	Динисторы и принцип их работы.
47	Тринисторы, их принцип действия и семейства ВАХ.
48	Симисторы, их принцип действия и основные особенности на примере диака
49	Симисторы, их принцип действия и основные особенности на примере триака.
50	Критическая скорость нарастания прямого тока тиристора. Эффект di/dt .
51	Критическая скорость нарастания прямого напряжения на тиристоре. Эффект du/dt .
52	Тиристор-диод, его устройство, принцип работы и основные особенности.
53	Параллельное включение полупроводниковых приборов.
54	Последовательное включение полупроводниковых приборов.
32	Семейства ВАХ транзистора в схеме с общим эмиттером и особенности схемы с ОЭ.
33	Семейства ВАХ транзистора в схеме с общей базой и особенности схемы с ОБ.
34	Т-образные эл. схемы замещения биполярного транзистора для постоянных составляющих сигнала.
35	Т-образные эл. схемы замещения биполярного транзистора для переменных составляющих сигнала.
36	П-образная гибридная эквивалентная электрическая схема замещения биполярного транзистора.
37	Малосигнальные параметры, их виды и особенности.
38	Системы h- и H-параметров
39	Системы Y- и y-параметров.
40	Системы Z- и z-параметров.
41	Импульсные биполярные транзисторы.

42	Методы улучшения частотных и импульсных свойств биполярных транзисторов. Дрейфовые транзисторы.
43	Полевые транзисторы с управляющим р-п-переходом, устройство, семейства ВАХ, схемы замещения .
44	Полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом, ВАХ, схемы замещения и.
45	Полевые транзисторы с изолированным затвором и встроенным каналом, ВАХ, схемы замещения .
46	Динисторы и принцип их работы.
47	Тринисторы, их принцип действия и семейства ВАХ.
48	Симисторы, их принцип действия и основные особенности на примере диака
49	Симисторы, их принцип действия и основные особенности на примере триака.
50	Критическая скорость нарастания прямого тока тиристора. Эффект di/dt .
51	Критическая скорость нарастания прямого напряжения на тиристоре. Эффект du/dt .
52	Тиристор-диод, его устройство, принцип работы и основные особенности.
53	Параллельное включение полупроводниковых приборов.
54	Последовательное включение полупроводниковых приборов.

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
7	Экзамен	«отлично»	Защищены все работы. Ответы на предложенные в билете вопросы верны.
		«хорошо»	Защищены все работы. Каждая незащищенная в течение семестра работа заменяется одним дополнительным теоретическим вопросом на экзамене. В ответе на два вопроса имеются неточности или ответ не полный.
		«удовлетворительно»	Каждая невыполненная в течение семестра работа заменяется одним дополнительным теоретическим вопросом на экзамене. В ответах на три вопроса имеются неточности или ответы не полные.
		«неудовлетворительно»	Ответ на два вопроса не дан или полностью неверный.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно- методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной биб- лиотеке / Наименование ЭБС
1	А. Н. Игнатов, В. Л. Сави- ных, Н. Е. Фадеева.	Основы электроники	учеб. пособие	2022	ЭБС "ZNANIUM.CO M"
2	Новиков, Ю. В.	Введение в цифровую схемотехнику	учеб. пособие	2024	ЭБС "IPRbooks"
3	Ю. А. Смирнов, С. В. Со- колов, Е. В. Титов.	Физические основы электроники	учеб. пособие	2022	ЭБС "Лань"

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1	Е. Л. Максина	Электроника	конспект лекций	2012	ЭБС "IPRbooks"
2	Д. В. Горденко, В. И. Никулин, Д. Н. Резеньков	Электротехника и электроника	учебное пособие	2018	ЭБС "IPRbooks"
3	Ф. А. Ткаченко	Электронные приборы и устройства	учебник	2017	ЭБС "ZNANIUM.COM"
4	Н. В. Суханова	Основы электроники и цифровой схемотехники	учеб. пособие	2017	ЭБС "IPRbooks"
5	В. В. Толмачев, Ф. В. Скрипник.	Физические основы электроники	учеб. пособие	2019	ЭБС "IPRbooks"
6	А. М. Водовозов	Основы электроники	учеб. пособие	2019	ЭБС "ZNANIUM.COM"

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

1. Elibrary[Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

2. Журнал «Силовая электроника» [Электронный ресурс] : науч. журн. / — Электрон. журн. — Москва, Санкт-Петербург. — Режим доступа к журн.: <http://power-e.ru/>

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1	Windows: WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc	договор № 757 от 04.07.2018, срок действия – бессрочно; контракт № 1653 от 14.12.2018, срок действия – бессрочно
2	Office Standard: Office Stdandard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition	договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – бессрочно

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1	Э-511 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации.	Столы ученические двухместные (моноблок) , столы ученические трехместные (моноблок) стол преподавательский, стул преподавательский, доска аудиторная (меловая).
2	Э-514 Лаборатория "Промышленная электроника"	Столы-стенды лабораторные , стол преподавательский, стулья с пюпитрами, стулья ученические, доска аудиторная, осциллограф С1-101 , осциллограф С1-112, генератор ГЗ-112/1 шт. генератор ГЗ-112 , генератор ГЗ-109, вольтметр Д567 , мультиметр В7-35 лабораторный стен-дЭС16, стенды измерительные, универсальный лабораторный стенд
3	Г-401 Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Столы, стулья, компьютеры

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования